

Diffractomètre PANALYTICAL X'pert Pro MPD

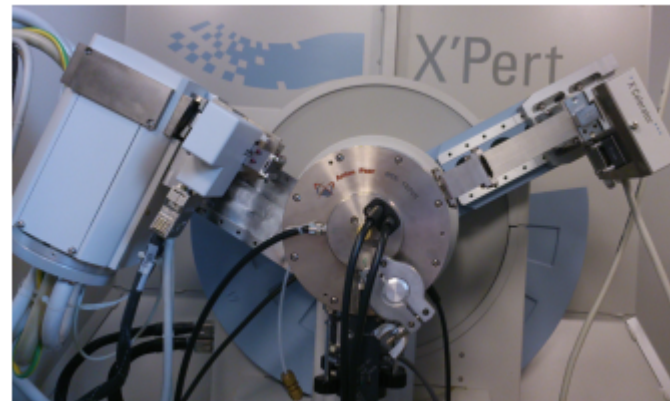
Anode Cu (8,1 keV)

Cet instrument autorise de multiples configurations. Il est essentiellement dédié à l'analyse qualitative d'échantillons polycristallins sous forme de poudres (identification de phases) dans des conditions classiques ou sous atmosphère contrôlée, de -190 à 1200°C dans une chambre à température contrôlée.

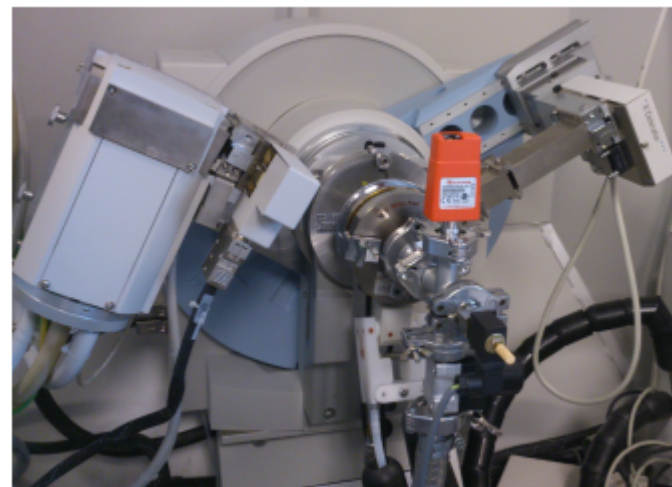
Il permet également la recherche des paramètres de maille, l'affinement de structures et l'analyse quantitative par la méthode de Rietveld.

Spécificités :

- Tube scellé avec anode en cuivre.
- Goniomètre 2-cercles θ - θ .
- Détecteur linéaire rapide X'Celerator.
- Monochromateur arrière.
- Mesure en géométrie Bragg-Brentano pour les analyses conventionnelles en réflexion sur porte échantillon plan.
- Support d'échantillon en silicium monocristallin permettant l'analyse de faibles quantités en réflexion.
- Mesures en transmission (Debye-Scherrer) sur capillaires (faisceau parallèle avec miroir de Goebel).
- Fentes de Sollers 0,04 ou 0,02°, fentes de divergence programmables (1/2 à 1/32°).
- Passeur automatique 15 positions.
- Mesures à basse température dans la chambre Anton Paar TTK 450 (-190 à 450°C).
- Mesures à haute température dans le four Anton Paar HTK 1200N (1200°C max).



Echantillon dans le four Anton Paar HTK 1200N



Echantillon dans le cryostat Anton Paar TTK 450